

# 中国科学院电工研究所高频场控功率器件及装置产品质量检验中心

版本号: V1/1	收费标准	文件编号: IEEPS/GLJL/01-002-1401		
测试类别	测试项目	计费单位	单价	
电气参数测试	电气参数测试设备开机费 (单次测试量大可减免)	次	1000	
	模块电气参数测试夹具定制	件	视情况	
	模块产品常温静态参数测试 ( $V_{CES} < 3kV$ 且 $I_{Cnom} < 2kA$ )	每只每小项	100	
	模块产品常温静态参数测试 ( $3kV \leq V_{CES} \leq 7kV$ 或 $I_{Cnom} \geq 2kA$ )	每只每小项	150	
	模块产品常温动态参数测试 ( $V_{CES} < 3kV$ 且 $50A \leq I_{Cnom} < 2kA$ )	每只每大项	200	
	模块产品常温动态参数测试 ( $3kV \leq V_{CES} \leq 7kV$ 或 $I_{Cnom} \geq 2kA$ )	每只每大项	250	
	模块产品高温静态参数测试 ( $V_{CES} < 3kV$ 且 $I_{Cnom} < 2kA$ )	每只每小项	150	
	模块产品高温静态参数测试 ( $3kV \leq V_{CES} \leq 7kV$ 或 $I_{Cnom} \geq 2kA$ )	每只每小项	200	
	模块产品高温动态参数测试 ( $V_{CES} < 3kV$ 且 $50A \leq I_{Cnom} < 2kA$ )	每只每大项	250	
	模块产品高温动态参数测试 ( $3kV \leq V_{CES} \leq 7kV$ 或 $I_{Cnom} \geq 2kA$ )	每只每大项	300	
	(晶圆产品单片最低收费500元)			
	晶圆产品常温静态参数测试 ( $V_{CES} < 3kV$ )	每颗每小项	8	
	晶圆产品常温静态参数测试 ( $3kV \leq V_{CES} \leq 7kV$ )	每颗每小项	10	
	芯片产品常温静态参数测试 ( $V_{CES} < 3kV$ )	每只每小项	150	
	芯片产品常温静态参数测试 ( $3kV \leq V_{CES} \leq 7kV$ )	每只每小项	200	
	芯片产品常温动态参数测试 ( $V_{CES} < 3kV$ 且 $I_{Cnom} \geq 50A$ )	每只每大项	250	
	芯片产品常温动态参数测试 ( $3kV \leq V_{CES} \leq 7kV$ 且 $I_{Cnom} \geq 50A$ )	每只每大项	300	
	晶圆产品高温静态参数测试 ( $V_{CES} < 3kV$ )	每颗每小项	12	
	晶圆产品高温静态参数测试 ( $3kV \leq V_{CES} \leq 7kV$ )	每颗每小项	15	
	芯片产品高温静态参数测试 ( $V_{CES} < 3kV$ )	每只每小项	200	
芯片产品高温静态参数测试 ( $3kV \leq V_{CES} \leq 7kV$ )	每只每小项	250		
芯片产品高温动态参数测试 ( $V_{CES} < 3kV$ 且 $I_{Cnom} \geq 50A$ )	每只每大项	300		
芯片产品高温动态参数测试 ( $3kV \leq V_{CES} \leq 7kV$ 且 $I_{Cnom} \geq 50A$ )	每只每大项	350		
热性能测试	热敏感系数标定	只	1500	
	结壳稳态热阻测试	只	1000	
	热阻测试分析报告	份	500	
杂散参数测试	回路电阻测试	只	300	
	杂散电感测试	只	300	
	结电容测试	只	1000	
绝缘测试	交流耐压测试	只	300	
抗静电能力测试	ESD测试—HBM, MM测试	每只每项	200	
	ESD测试—CDM测试	只	400	
EMI测试	辐射干扰测试	小时	2000	
	传导干扰测试	小时	1500	
	EMI分析报告	份	500	
温度场分布测试	硅胶去除及喷漆	只	1500	
	红外热成像试验	小时	1500	
	红外热成像分析报告	份	500	

测试类别	测试项目	计费单位	单价
通电环境应力可靠性测试	高温高湿反偏试验（第1小时起）	小时	450
	高温高湿反偏试验（第2小时起）	小时	30
	高温反偏试验（第1小时起）	小时	450
	高温反偏试验（第2小时起, $V_{CES} < 3kV$ ）	小时	25
	高温反偏试验（第2小时起, $3kV \leq V_{CES} \leq 7kV$ ）	小时	35
	高温门极反偏试验（第1小时起）	小时	450
	高温门极反偏试验（第2小时起）	小时	30
	短时功率循环试验（第1小时起）	小时	1000
	短时功率循环试验（第2小时起, $I_{Cnom} \leq 600A$ ）	小时	100
	短时功率循环试验（第2小时起, $600A < I_{Cnom} \leq 2kA$ ）	小时	120
	短时功率循环试验（第2小时起, $I_{Cnom} > 2kA$ ）	小时	150
	长时功率循环试验（第1小时起）	小时	1000
	长时功率循环试验（第2小时起, $I_{Cnom} \leq 600A$ ）	小时	100
	长时功率循环试验（第2小时起, $600A < I_{Cnom} \leq 2kA$ ）	小时	120
	长时功率循环试验（第2小时起, $I_{Cnom} > 2kA$ ）	小时	150
	无偏压高温蒸煮试验（第1个小时起）	小时	450
	无偏压高温蒸煮试验（第2个小时起）	小时	35
	偏压高温蒸煮试验（第1个小时起）	小时	500
	偏压高温蒸煮试验（第2个小时起）	小时	50
	非通电环境应力可靠性测试	高温存储试验（第1小时起）	小时
高温存储试验（第2小时起）		小时	20
低温存储试验（第1小时起）		小时	300
低温存储试验（第2小时起）		小时	30
温湿度试验（第1小时起）		小时	300
温湿度存储试验（第2个小时起）		小时	30
温湿度循环试验（第2个小时起）		小时	35
温度冲击试验（第1个小时起）		小时	500
温度冲击试验（第2个小时起）		小时	100
高温低气压试验（第1小时）		小时	400
高温低气压试验（第2小时）		小时	250
盐雾试验（第1小时）		小时	350
基本盐雾试验（第2小时）		小时	50
饱和湿度循环盐雾试验（第2小时）		小时	70
控制湿度循环盐雾试验（第2小时）		小时	100
温度循环试验（第1小时起）		小时	300
温度循环试验（第2个小时起/每分钟小于5度）		小时	80
温度循环试验（第2个小时起/每分钟5度）		小时	100
温度循环试验（第2个小时起/每分钟10度）		小时	120
温度循环试验（第2个小时起/每分钟15度）		小时	150
温湿度振动三综合试验（第1小时起）		小时	1000
温湿度振动三综合试验（第2个小时起）		小时	500

测试类别	测试项目	计费单位	单价
机械完整性测试	振动试验（第1小时）	小时	500
	振动试验（第2小时）	小时	350
	冲击/碰撞试验	次	700
高加速寿命测试	高加速寿命试验（振动加速度小于80GRMS）	小时	1500
	高加速寿命试验（振动加速度大于等于80GRMS）	小时	2000
	高加速寿命试验分析报告	份	500
焊接强度测试	拉力强度试验（不超过200kgf）	小时	1500
	拉力强度试验（超过200kgf）	小时	2000
	剪切力强度试验（不超过200kgf）	小时	1500
	剪切力强度试验（超过200kgf）	小时	2000
非破坏性故障分析	超声波扫描显微镜分析（允许样品与液体接触）	小时	1500
	超声波扫描显微镜分析（不允许样品与液体接触）	小时	2000
	超声波扫描显微镜分析报告	份	500
	X射线检测设备开机费	次	1000
	二维X射线检测（最长尺寸小于140mm且管电压不超过160kV）	小时	1500
	二维X射线检测（最长尺寸不小于140mm或管电压超过160kV）	小时	2000
	三维X射线检测	小时	2000
	X射线检测分析报告	份	500